

## 第90回分析基礎セミナー

# プロに学ぶ・走査電子顕微鏡

【日時】 2015/4/22 (水) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部大講義室 (総合学習プラザ2F)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社日立ハイテクノロジーズ

### 13:00-14:00 SEMの原理を知って装置を理解する

SEMの原理、基礎から装置構成など技術的な内容を含めた解説です。  
今回は1時間で可能な限り密度の高い内容をお伝えすることを目指します。

### 14:00-15:00 SEM観察のためのノウハウ

試料に応じた前処理の方法と操作テクニックをお教えします。またよくある質問に関しても具体例を示しながら解説します。

### 15:15-16:05 SEMを120%活用する

中央分析センターに設置されている日立ハイテクノロジーズ製のSEM (SU8000, SU6600並びに新設SU3500) の性能・特徴と使い分けについて詳細に解説します。

### 16:05-17:00 最新アプリケーションの紹介

極低加速電圧観察で実現したナノレベル表面観察や大立体角を備えたEDX機能、サンプルの状態を問わない最新の大気圧SEMについて紹介します。

今年度の分析基礎セミナーは、過去に好評を博した「プロに学ぶ」シリーズです。機器メーカーならではのプロフェッショナルな内容にご期待ください。

今回は走査電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope: SEM)です。現場で困っている方、よりよいデータを取得されたい方にも有用です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。途中入退室も自由ですのでご都合に合わせてご参加ください。

#### 【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857  
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp